

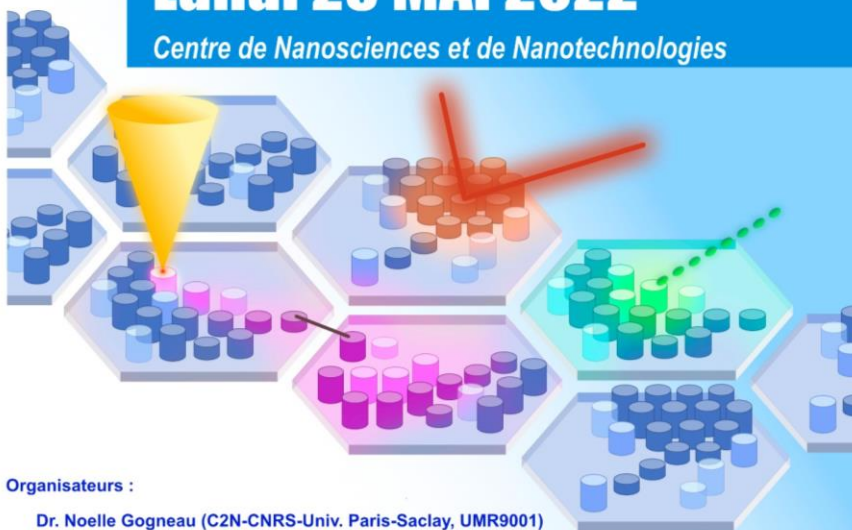
NANO-CARACTÉRISATION / NANO-MÉTROLOGIE

INSTRUMENTATION À L'ÉCHELLE NANO

Rencontre Académiques-Industriels

Lundi 23 MAI 2022

Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies



Organisateurs :

Dr. Noelle Gogneau (C2N-CNRS-Univ. Paris-Saclay, UMR9001)
Noelle.gogneau@c2n.upsaclay.fr

Prof. Alexandre Dazzi (ICP-CNRS-Univ. Paris-Saclay, UMR8000)
alexandre.dazzi@universite-paris-saclay.fr

Dr. Juan-Ariel Levenson (C2N-CNRS-Univ. Paris-Saclay, UMR9001- Club nanométrie)
juan-ariel.levenson@c2n.upsaclay.fr

Partenaires industriels confirmés



INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE jusqu'au 16 mai 2022 [Lien](#)



Journée Nano-caractérisation / Nano-métrie Instrumentation à l'échelle nano

Programme en cours de finalisation

Présentations orales confirmées

- Présentation du club Nanométrie - A. Levenson, C2N-CNRS-Univ. Paris-Saclay.
- Pyramide Métrie - Orateur à venir.
- Tip Enhanced Raman Spectroscopy - E. Maisonhaute, LISE Sorbonne Univ.
- Atomic Force Microscopy based IR spectroscopy - A. Dazzi, Institut de Chimie Physique, Univ. Paris-Saclay.
- Présentation du projet européen "Photoquant" d'Euramet, sur la nanométrie thermique : résultats et perspectives - S. Briaudeau, Conservatoire National des Arts et Métiers LCM - LNE – CNAM.
- Synthesis of Nanoparticles as reference materials : Metrological measurements and in-situ kinetics in lab with Small Angle X-Ray Scattering - O. Taché, CEA – Univ. Paris-Saclay, IRAMIS-NIMBE- LIONS.
- Quantitative assessment of GaAs doping at the nanoscale by cathodoluminescence - S. Collin, C2N-CNRS-Univ. Paris-Saclay.
- Electrical Scanning Probe Microscopy approaches to investigate nanomaterials, devices and junctions - J. Alvarez, GeePs, Univ. Paris-Saclay, CentraleSupélec, Sorbonne Univ. CNRS.
- Mesures mécaniques à l'échelle nano - M. Febvre, Bruker nano.
- Le rayonnement thermique revisité aux petites échelles - Y. de Wilde, CNRS-Institut LANGEVIN, ESPCI Paris.
- WaveMode: AFM off-resonance imaging remastered - M. Portalupi, Nanosurf AG.
- Structure de l'extrême surface de nanoparticules isolées par XPS - O. Sublemontier, CEA – Univ. Paris-Saclay, IRAMIS-NIMBE- LEDNA.
- Exploring multiferroics with scanning probe microscopies: from PiezoForce Microscopy to scanning NV magnetometry - V. Garcia, Unité Mixte de Physique CNRS-Thales.
- Analyse de systèmes colloïdaux par Le Nanotrak Flex ; une DLS fibrée - J-M. Sabatié, Microtrak MRB - Verder
- Etude Inter-comparative - retour d'expérience - Orateur à venir.

Session Poster

Table ronde : Mesures prospectives, Alliances industriels/académiques, Mesure de modules Young, Mesures non destructives aux échelles nano, Production industrielle...